

## 主な仕様

		テラヘルツ分光システム		
		TAS7400SL (低周波仕様)	TAS7400SP (標準仕様)	TAS7400SU (広帯域仕様)
測定モード		分光解析 (透過/反射)*1	分光解析 (透過/反射/ATR/透過偏光解析)*1	分光解析 (透過/反射/ATR)*1
対象試料		誘電体材料、化学物質、その他試薬	化学物質、工業材料、生体、医薬、その他試薬	
試料寸法	透過/反射モード	φ20 mm ~ 30 mm、厚さ10 mm以下	φ5 mm ~ 30 mm、厚さ10 mm以下	
	ATRモード	—	φ5 mm以下(粉体、液体)、φ5 mm ~ 20 mm、厚さ10 mm以下(固体)	
	透過偏光解析モード	—	φ5 mm ~ 30 mm、厚さ10 mm以下	
測定性能	周波数レンジ*2	0.03 ~ 2 THz	0.1 ~ 4 THz	0.5 ~ 7 THz (透過/反射モード) 0.5 ~ 6.5 THz (ATRモード)
	周波数精度*2	±10 GHz以下 (0.56 THzにて)	±10 GHz以下 (1.4 THzにて)	±10 GHz以下 (1.4 THzにて)
	周波数分解能	1.9 GHz / 7.6 GHz	1.9 GHz / 7.6 GHz	1.9 GHz / 7.6 GHz
	ダイナミックレンジ*2*5 (ピーク周波数にて)	50dB以上	60dB以上	57dB以上 (透過/反射モード) 55dB以上 (ATRモード)
スループット	200 msec/スキャン			
測定用アクセサリ	透過モード/透過偏光解析モード(SPのみ対応): 固体ホルダ、液体・粉末用セル*3、ドライエアー遮断キット*3、回転ホルダ*3 反射モード: 反射ミラー、回転ホルダ*3 ATRモード (SP/SUのみ対応): 粉体用ホルダ			
表示機能	スペクトル表示(透過率、反射率、ATR)、位相差、吸光度、吸収係数、複素屈折率、複素誘電率) *ATRはSP/SUのみ対応 時間応答表示(電界強度)			
ソフトウェア*3	偏光解析アプリケーション、自動制御、FDA21CFR Part111対応、オフライン解析			
ドライエアーパーズ	ドライエアーユニット付属 (外部エアーの供給が別途必要)			
外部モジュール*4	温度制御モジュール(-10 ~ +80℃タイプ、室温 ~ +300℃タイプ)			
コントローラ	標準付属 (OS: Windows7 Pro. 64bit)			
データファイル形式	独自バイナリ、JCAMP-DX、SPC、CSV			
一般仕様	使用環境	温度範囲: +10℃ ~ +30℃ 相対湿度: 80%以下(結露しないこと)		
	保存環境	温度範囲: -10℃ ~ +50℃ 相対湿度: 80%以下(結露しないこと)		
	電源	解析ユニット: AC100V(100-120)/200V( 220-240)±10%, 50/60 Hz, 180VA 測定ユニット: AC100V(100-120)/200V( 220-240)±10%, 50/60 Hz, 150VA ※解析PCを除く		
	外形寸法/質量	解析ユニット:寸法: 430(W) × 540(D) × 330(H) mm /30 kg以下 測定ユニット:寸法: 500(W) × 490(D) × 410(H) mm /40 kg以下		

\*1:テラヘルツ分光システムは、測定モジュール(透過、反射、ATR、透過偏光解析)を選択する必要があります。

\*2:温度範囲 23℃±5℃にて

\*3:オプション

\*4:オプション (透過モードのみ対応)

\*5:各周波数におけるパワーレベルには個体差があります。周波数分解能7.6GHz 積算回数16384

## 温度制御モジュール

項目	TAS1020	TAS1030	備考
温度可変範囲	-10.0~+80.0℃	室温~+300℃	—
設定分解能	0.1℃	1.0℃	—
制御インターフェース	USB		システムと独立に制御可能
対応モジュール	透過モジュール		—